

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2006年1月5日(05.01.2006)

PCT

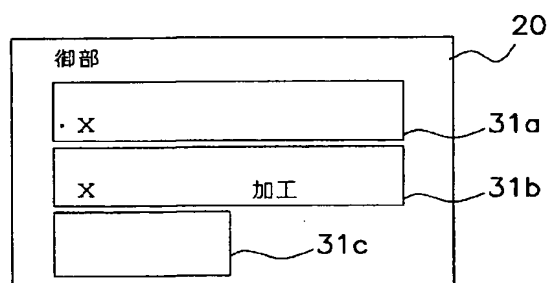
(10) 国  
WO 2006/001107 A1

- (51) 国際特許分類<sup>7</sup>: GOIN 23/18  
(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/005537  
(22) 国際出願日: 2005年3月25日(25.03.2005)  
(25) 国際出願の言語: 日本語  
(26) 国際公開の言語: 日本語  
(30) 優先権子ータ: 特願2004-185767 2004年6月24日(24.06.2004) JP  
(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 株式会社イシダ(ISHIDA CO., LTD.) [JP/JP]; 〒6068392 京都府京都市左京区聖護院山王町4番地 Kyoto (JP).  
(72) 発明者; および  
(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 廣瀬 修 (HIROSE, Osamu) [JP/JP]; 〒2150021 神奈川県川崎市麻生区上麻生5-7-16-102 Kanagawa (JP).  
(74) 代理人: 小野 由己男, 外 (ONO, Yukio et al.); 〒5300054 大阪府大阪市北区南森町1丁目4番19号 サウスホレストビル 新樹グローバル・アイビー特許業務法人 Osaka (JP).  
(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可86): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, ME, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW  
(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可86): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), オーストラリア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).  
添付公開書類:  
— 国際調査報告書

[続葉有]

(54) Title: X-RAY INSPECTION APPARATUS, AND METHOD FOR CREATING AN IMAGE PROCESSING PROCEDURE OF THE X-RAY INSPECTION APPARATUS

(54) 発明の名称: X線検査装置およびX線検査装置の画像処理手順の生成方法



- 20 CONTROL UNIT  
31a IMAGE CREATION UNIT  
X-RAY IMAGE CREATION  
WORKING IMAGE CREATION  
31b ADOPTED IMAGE PROCESSING PROCEDURE DETERMINATION UNIT  
X-RAY IMAGE CREATION  
WORKING IMAGE CREATION  
31c FOREIGN SUBSTANCE DECISION UNIT  
FOREIGN SUBSTANCE INCLUSION DECISION

(57) Abstract: To provide an X-ray inspection apparatus enable to inspect an inspection object by automatically selecting an image processing procedure optimum for the object. The X-ray inspection apparatus (10) comprises a shield box (11), a conveyor (12), an X-ray irradiator (13), an X-ray line sensor (14), a monitor (26) and a control computer (20). In the control computer (20), a CPU (21) reads the various programs stored in the storage unit of an HDD (25) or the like, and forms an image creation unit (31a), an adopted image processing procedure creation unit (31b) and a foreign substance decision unit (31c) as functional blocks.

[続葉有]



2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

この要約： 装置が自動的に検査対象となる物品に対して最適な画像処理手順を選択して検査を行うことが可能なX線検査装置を提供するため、X線検査装置(10)は、シールドボックス(11)と、コンベア(12)と、X線照射器(13)と、X線ラインセンサ(14)と、モニタ(26)と、制御コンピュータ(20)とを備えている。制御コンピュータ(20)は、CPU(21)がHDD(25)等の記憶部に格納された各種プログラムを読み込んで、画像形成部(31a)、採用画像処理手順生成部(31b)および異物判定部(31c)を機能ブロックとして形成する。